

# 制御層情報連携意見交換会

## Control Layer Informational Cooperation (CLiC)

### ■ IAF CLiC活動目的

- ・制御層における情報連携の有効性の確認と国際標準規格※の活用検討
- ・新規技術項目の創出と標準化の提案

※情報連携で国際標準規格を用いるメリット

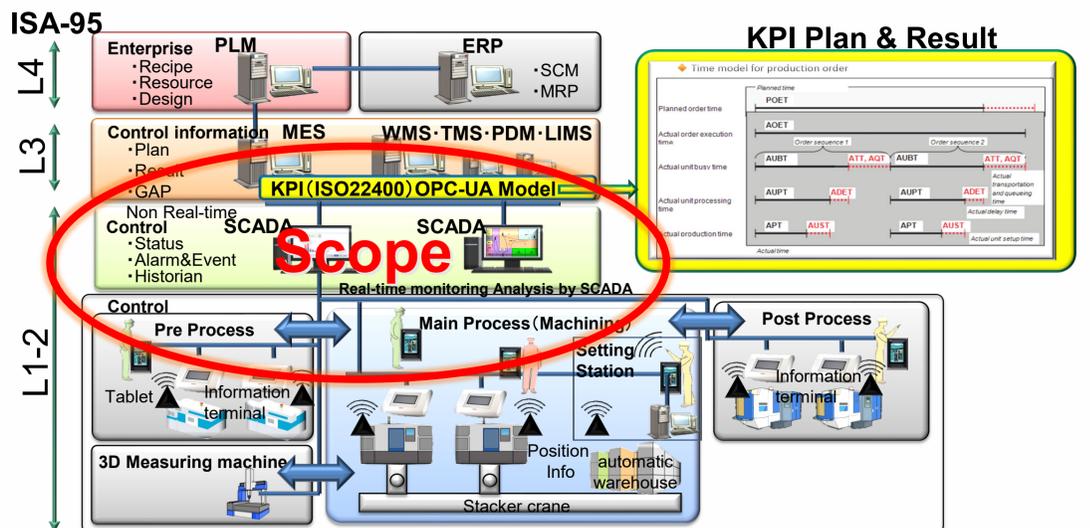
- ①規格化された共通機能を簡単に使える
- ②国際的なビジネスにおいて有利になる

### ■ シーズ分科会

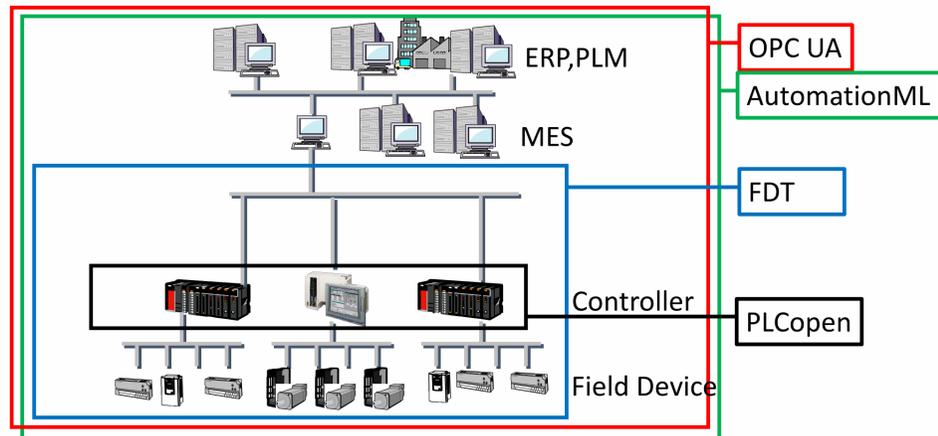
目的：Industrial IoT(IIoT)における、生産システムの情報連携で注目すべき国際標準規格の選定と、その連携を検討

- 実績：・KEI MODELに有効なユースケースの提案(ネットワークプロファイルのKPI定義によるKPI計算効率化の検討)  
 ・KPI情報取得に関する各団体技術の活用検討(プロファイル、FB、Automation ML のスタディ)

注目すべき国際標準規格：OPC UA、PLCopen、FDT、AutomationML



国際標準規格	IEC 文書番号	説明
OPC UA 	IEC 62541	産業システム間の相互運用を実現する通信技術の国際標準
FDT 	IEC 62453	産業システムのデバイスやネットワークのインテグレーションの用途で活用されているオープンなソフトウェアインターフェース技術
PLCopen 	IEC 61131-3	PLC アプリケーションの開発効率化を目的とした PLC プログラミングの国際標準
AutomationML 	IEC 62714	プラントエンジニアリング情報の記述のために設計されたXML スキーマベースのベンダ非依存な中立的データフォーマット



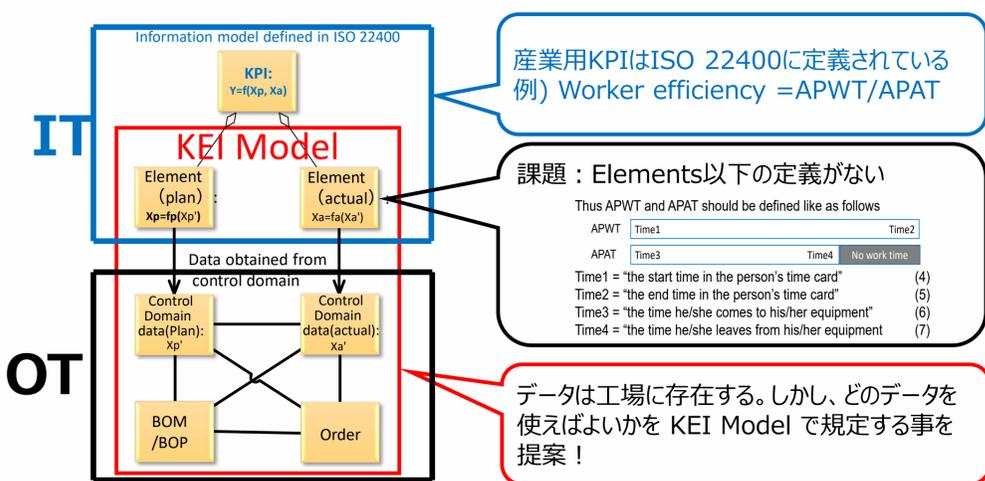
※ISO/IECで関連する国際標準規格は660以上 各技術のスコープ：OPC UA、PLCopen、FDT、AutomationML

### ■ KPI分科会

目的：産業用KPI(ISO 22400)の利用において KPI Elementを標準化する方法論の確立と実証を行う。

また、SMKLプロジェクトとの連絡を行う

実績：製造現場の炭素排出量をIIoT化の評価指標(KPI)として提案。また、それを見える化するSMKL指標を提案。



KEI Modelとは？  
 (KPI Element Information Modelの略)

→製造現場側(OT)が作る情報モデルを、IT側へ提供し情報ギャップを解消！

